合金化/脱合金化法による 白金板表面へのナノポーラス構造形成

袴田昌高¹ 千野靖正² 馬渕 守¹

1京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻 2独立行政法人産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門

J. Japan Inst. Metals, Vol. 75, No. 1 (2011), pp. 42–46 Special Issue on Toward New Perspective for Realization of Functionality in Elements © 2011 The Japan Institute of Metals

Formation of Nanoporous Structure on Pt Plate Surface by Alloying/Dealloying Technique

Masataka Hakamada¹, Yasumasa Chino² and Mamoru Mabuchi¹

¹Department of Energy Science and Technology, Graduate School of Energy Science, Kyoto University, Kyoto 606–8501

²Materials Research Institute for Sustainable Development, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Nagoya 463–8560

For the application of high–surface–area nanoporous platinum (Pt) to catalytic device, electrodes and sensors, dealloying technique, which can synthesize nanoporous Pt, was combined with surface alloying technique. As a result, nanoporous structure with ligament and pore sizes below 10 nm was successfully fabricated on the Pt plate surface. Cyclic voltammetry in H_2SO_4 indicated that the nanoporous structure increases the true surface area by 170 times. The approximation by spherical pore model suggested that the nanoporous surface layer has a thickness of 200 nm.

(Received August 19, 2010; Accepted September 16, 2010)

Keywords: dealloying, nanoporous structure, platinum, cyclic voltammetry, surface area, surface alloying

1. 緒 言

白金(Pt)はクラーク数が 5×10⁻⁷ と極めて低く,しかも 鉱床の偏在が著しくその生産の 75%以上は南アフリカから の生産である¹⁾ことから,金属資源のなかでもきわめて希少 である.加えて,近年の環境問題の高まりを受けて自動車排 ガス浄化用触媒としての需要が急激に高まったことから, Pt の価格が高騰するなど,Pt の供給は不安定化した.

触媒として Pt が用いられる際には,ナノ粒子としてメソ ポーラスシリカなどのポーラス体に担持させる手法が主流で ある²⁾. Pt の触媒作用は Pt 表面で起こるため, Pt 粒子のサ イズをナノメートルオーダまで小さくすることで比表面積が 大きくなり,少ない使用量で大きな触媒活性を得ることが可 能である.

ナノメートルオーダにまで寸法を小さくすることで表面積 を稼ぐもう一つの手法として、Pt そのものをナノポーラス 化することが挙げられる^{3,4)}.ナノポーラス化の手法として 簡便なのが脱合金化法である⁵⁾.脱合金化法では貴な金属と 卑な金属の2元系合金から卑な金属のみを酸などの電解液 中で溶解除去することで、溶解せずに残った貴な金属がナノ メートルオーダの孔径の開気孔構造を形成する.これまでの 研究により、Pt^{3,4)} や Au⁵⁾ をはじめ、Pd⁶⁻⁸⁾、Cu^{9,10)}、Ni¹¹⁾ など種々の金属をナノポーラス化することができることがわ かっている.

脱合金化により作製されるナノポーラス Pt は約5 nm か それ以下の超微細孔径を有し^{3,4)},ナノ粒子に匹敵する高い 比表面積を有している.また,他のポーラス体に Pt ナノ粒 子を担持させる手法ではリサイクル時に担体と Pt ナノ粒子 を分離する必要があるが,ナノポーラス Pt では Pt そのも のがナノポーラス構造を有しており担体との分離が不要であ ることから,リサイクル時の回収が容易である.しかし,一 般に脱合金化で作製されるナノポーラス金属はもろく^{12,13)}, 取り扱いの多くを粉体状に限ることとなる.

金属のナノポーラス構造を触媒や電極・センサなどとして 用いる場合,金属のごく表面だけが多孔質化していれば,そ の機能を発揮できると考えられる.つまり,バルク全体をナ ノポーラス化するのでなく,表面のみを必要最低限なだけナ ノポーラス化しさえすれば,板材や線材として利用可能であ るから扱いが非常に容易になり,応用可能性を広げられる. そこで本研究では,Pt板の表面を合金化したのち脱合金化 することで,Pt板表面にナノポーラス構造を形成させるこ とを試みた.

2. 実験方法

合金化/脱合金化による Pt 表面のナノポーラス化の模式 図を Fig. 1 に示す.まず,真空室内の黒鉛電極間に,表面 を 4000 番で研磨した Pt 板(田中貴金属製, 厚さ約 0.7 mm) の上に市販の Cu 箔(ニラコ製, 厚さ約 30 µm)を重ねた試料 を配置し, 2.6 kN の荷重で電極間に固定したうえで 973 K・10 分間の通電加熱を行うことにより, Pt および Cu の 相互拡散により表面を合金化した.通電加熱には放電プラズ マ焼結装置(住友石炭鉱業製)を用いた.その後,表面を合金 化した試料を作用電極,対極を Pt 板,基準電極を飽和カロ メル電極(SCE)とした三極式の電解セルを用いて 0.1 mol/L H₂SO₄ 溶液中+1.1 V(SCE 基準,以降電位は SCE 基準で記 述する)で定電位電解を 22 時間行った(脱合金化).この電 解の過程で,合金化した表面から Cu が溶解除去されると同 時に,溶解しない Pt は固体/電解液界面で拡散・自己集積 し,ナノポーラス構造を形成する^{3,4)}.電解後の試料は純水



Fig. 1 Fabrication of nanoporous architecture on Pt plate surface by alloying/dealloying technique.

で洗浄し、以下に述べる観察・分析に供した.

電解前後の試料についてエネルギー分散型 X 線分光 (EDXS)分析装置を備えた電解放出型走査型電子顕微鏡 (FE-SEM)で表面構造観察および元素分析を行った.また,試料表面の X 線回折(XRD)分析により表面の相を同定 した.

さらに、ナノポーラス化にともなう表面積増加率の測定を サイクリックボルタンメトリ(CV)により行った¹⁴⁾.表面を 4000番まで研磨した平滑 Pt 板表面および合金化/脱合金化 によりナノポーラス化したナノポーラス Pt 板表面の一定面 積(12 mm²)を露出させて作用電極とし(残りの部分は保護 テープで被覆した)、5 mV/s の走査速度で+1.30 V から -0.25 V まで電位を走査した際の電流応答を測定した.電 解液は 0.1 mol/L H₂SO₄ を用いた.脱合金化のための定電 位電解・表面積増加率測定のための CV はいずれもポテンシ ョスタットを用いて室温(298 K)で行われた.

ナノポーラス構造の比較参照のため、アーク溶解炉で調製 後に冷間圧延により薄板状にした Pt_{0.2}Cu_{0.8} 合金も同条件で 脱合金化に供し、粉末状のナノポーラス Pt を得た.得られ たナノポーラス Pt 粉末は樹脂埋め・切り出し・イオン研磨 により薄片化し、透過電子顕微鏡(TEM)による微細構造観 察を行った.



200 nm



20 nm



10 nm

Fig. 2 (a) Scanning electron micrograph of nanoporous structure fabricated on nanoporous Pt plate surface by alloying/dealloying technique. (b) and (c) Transmission electron micrograph of powdery nanoporous Pt fabricated by dealloying of $Pt_{0.2}Cu_{0.8}$ for comparison.

3. 結果および考察

脱合金化中の電流変化を測定した結果,電解初期には検出 できる程度の大きさの電流が流れたものの時間とともに電流 は小さくなり,22時間後には電流がほとんど検出されなく なった.また,通電加熱後・脱合金化前の試料表面はCuの 赤褐色を呈していたのに対し,脱合金化後の試料表面は黒色 であった.Ptナノ粒子の凝集多孔質体である白金黒も同様 の黒色を呈することから,これらの結果は22時間の脱合金 化で溶解しきれるだけのCuが溶解・除去され,Ptのナノ ポーラス構造が形成されたことを示唆している.

合金化/脱合金化法により処理した Pt 板表面の FE-SEM 写真を Fig. 2(a)に示す.像が明瞭ではないものの,径が 10 nm かそれ以下のリガメントが三次元的につながり,ポーラ ス構造を形成していることが推測される.Fig. 2(b)および (c)に TEM 写真を示すように,比較対象として Pt_{0.2}Cu_{0.8}を 同条件で脱合金化して得られたナノポーラス Pt においても 径 10 nm 以下のリガメントがつながったナノポーラス構造 が観察された.

1. 緒言でも述べたように,過去の研究により,Pt-Cu 合 金の脱合金化により孔径あるいはリガメント径が 3 nm 程度 のナノポーラス Pt が形成されることが明らかにされてい る^{3,4)}.今回の合金化/脱合金化法においても過去の研究と同 様のメカニズムで,通電加熱時により表面に形成した Pt-Cu 合金層を脱合金化することにより 10 nm 以下の孔径のナ ノポーラス Pt 構造を表面に構築することができたと考えら れる.

脱合金化前後の試料表面の EDXS 分析結果を Fig. 3 に示す. 脱合金化前の表面からは主に Cu が検出されたが, 微量

ながら Pt のピークも検出されており(Fig. 3(a)),通電加熱 中に Pt および Cu が相互拡散したことを示唆している.一 方,脱合金化後の試料表面からは Pt が主成分として検出さ れ,Cu は検出されなかった(Fig. 3(b)).H₂SO₄中での脱合 金化により Cu が溶解除去される一方,溶解せずに残った Pt が Fig. 2(a)に示すようなナノポーラス構造を形成してい ることが示唆される.

脱合金化前後の試料表面の XRD 分析結果を Fig. 4 に示す. EDXS 分析結果と同じく,脱合金化前の表面からは Cu 相が 検出された.一方脱合金化後の試料表面からは強度が著しく 低いものの Pt 相のピークが検出され,また確定的ではない ものの,PtCu 相に相当すると思われる低強度かつブロード なピークも検出された.強度の低い Pt 相ピークの検出は, Pt によるナノ構造の存在を示唆する¹⁵⁾.また,脱合金化時 に電流がほとんど流れなくなるまで Cu を除去したものの, EDXS では検出できない程度の微量の Cu が PtCu として残 留している可能性がある.これは Fig. 5 に模式図を示すよ うに,相互拡散による表面合金化の際に濃度が深さ方向に傾 斜分布し,脱合金化によりナノポーラス Pt を形成できる Cu 濃度の下限である約 55 at%¹⁶⁾を下回る深い領域では Cu が溶解されずに材料中に残存するためであると推測される.

Fig. 6 に平滑 Pt 板表面および合金化/脱合金化によりナノ ポーラス化したナノポーラス Pt 板表面を作用電極として用 いた CV 測定結果を示す. どちらの CV 曲線の形も Pt を作 用電極として H₂SO₄ 中で測定した際の典型的なものの形と 一致する¹⁷⁾. このことより,上で述べたナノポーラス Pt 表 面の残留 Cu が Pt 表面の電気化学的性質を大きく変えるほ どの影響をもっていないことを推測できる.一方で,脱合金 化により作製されるナノポーラス Pt の電気化学的特性に残 留 Cu がよい影響を及ぼすという報告もある¹⁷⁾. Fig. 6 にお



Fig. 3 Energy–dispersive X–ray spectra of Pt surface (a) alloyed with Cu by hot pressing and (b) subsequently dealloyed in H_2SO_4 .



Fig. 4 X–ray diffraction patterns of Pt surface (a) alloyed with Cu by hot pressing and (b) subsequently dealloyed in $\rm H_2SO_4.$

いて、+0.5 V から+1.2 V までの正方向の電位走査時の電 流増加は表面酸化被膜生成を示す¹⁸⁾が、電流が増加する立 ち上がりの電位はナノポーラス Pt 板表面を作用電極として 用いた場合のほうが低く、これが残留 Cu の影響である可能 性もある.

Fig. 6の縦軸の値に注目すると,ナノポーラスPt 板表面 を作用電極として用いた場合,平滑Pt 板表面に比べて100 倍以上の大きさの電流が流れていることがわかる.これは合 金化/脱合金化により板の実効表面積が拡大したことによる と考えられる.水素吸着を示す0Vから-0.25Vまでの負 方向の電位走査時のピークの積分値(ただし電気二重層の寄 与を補正する)から,以下の式により表面積が平滑面の何倍



Fig. 5 Depth profile of Cu concentration at alloyed surface of Pt which causes residual Cu after dealloying.

かを算出できる¹⁴⁾.

 $A_{np}/A_{flat} = Q_{H, np}/Q_{H, flat}$ (1) ここでA は実効表面積, Q_H は水素吸着を示す CV 曲線の ピーク積分値であり, 添え字 np および flat はナノポーラス 板表面および平滑板表面を表す.式(1)に従い, Fig. 6 の CV 曲線から表面積の増加率 A_{np}/A_{flat} を計算すると約 170 である.

試みとして、表面のナノポーラス層厚さが孔径の何倍かを、 Fig. 7 に示す単純なモデルにもとづいて考察する.ナノポー ラス構造の孔を直径 d の球で近似すると、孔の表面積は πd^2 である. この孔が表面積 A の平滑表面層に孔 1 層分だけ導 入されポーラス構造を形成するとした場合、表面積増加率は $\pi d^2N/A$ (ただし N は表面 1 層に含まれる孔の数)である. 一方表面ポーラス層内の気孔率(気孔の占める体積比率)を pとすると $p = \pi d^2N/6A$ であるから、結局孔 1 層分のポーラ ス層による表面積増加率は 6p と計算される. 層数 L のポー ラス層による表面積増加率は 6pL であるから、式(1)で求 められる表面積増加率を R とすると

$$L = R/6p \tag{2}$$



Fig. 7 Estimation of increase in surface area by spherical pore model.



Fig. 6 Cyclic voltammetry curves for (a) flat and (b) nanoporous Pt surfaces measured in $0.1 \text{ mol}/L \text{ H}_2 \text{SO}_4$.

である. 今回の結果では R=170 であり, 仮に気孔率 p=0.7 とする(表面合金化をした時点で Cu 濃度は Fig. 5 のように 深さ方向に傾斜しているため、脱合金化によって得られるナ ノポーラス層の気孔率も深さ方向に傾斜していると考えるの が妥当であるが、粗い近似としてナノポーラス金属で一般的 に実現可能な気孔率を採用する)とLは約40と計算される. Fig. 2 より孔径を約5nm とするとナノポーラス層の厚さは 5×40=200 nm 程度と見積もられる.

Liu らは Pt-Cu めっき膜を脱合金化する手法でナノポー ラス Pt を作製し, CV 測定の結果, 700 を超える表面積増 加率を実現している¹⁹⁾. 今回の表面積増加率の値 170 は Liu らの表面積増加率に比べると小さいが、これは主としてナノ ポーラス層の厚さが異なることによるものと推測される.表 面合金化の条件を変えて合金層厚さをより大きくすることに より最終的に得られるナノポーラス表面層の厚さも大きくす れば、実効表面積をさらに大きくできるものと考えられる.

4. 結 言

通電加熱を利用した合金化/脱合金化法により, Pt 板表面 に 10 nm 以下の孔径を有する三次元ナノポーラス構造を簡 便に構築できた. CV 測定の結果,ナノポーラス Pt 板表面 の実効表面積は平滑 Pt 板表面に比べ約 170 倍に拡大されて いることがわかった.この結果をもとに気孔を球で近似した 大まかな推算では、ナノポーラス表面層の厚さは 200 nm 程 度であると見積もられた.

本研究の一部は触日本学術振興会科学研究費補助金(課題

番号 22656155)の助成を受けて実施された.

文 献

- 1) D. Jollie: *Platinum 2010*, (Johnson Matthey, Royston, 2010) pp. 4 - 5
- 2) R. M. Rioux, H. Song, J. D. Hoefelmeyer, P. Yang and G. A. Somorjai: J. Phys. Chem. B 109(2005) 2192-2202.
- 3) D. V. Pugh, A. Dursun and S. G. Corcoran: J. Mater. Res. 18 (2003) 216–221.
- 4) D. V. Pugh, A. Dursun and S. G. Corcoran: J. Electrochem. Soc. 152 (2005) B455-B459.
- A. J. Forty and P. Durkin: Philos. Mag. A 42(1980) 295-318. 5)
- 6) M. Hakamada and M. Mabuchi: Mater. Trans. 50(2009) 431-435.
- 7) M. Hakamada and M. Mabuchi: J. Alloy. Compd. 479(2009) 326-329.
- 8) M. Hakamada, K. Tajima, K. Yoshimura, Y. Chino and M. Mabuchi: J. Alloy. Compd. 494(2010) 309-314.
- 9) U.-S. Min and J. C. M. Li: J. Mater. Res. 9(1994) 2878-2883. 10) J. R. Hayes, A. M. Hodge, J. Biener, A. V. Hamza and K. Sieradzki: J. Mater. Res. 21 (2006) 2611-2616.
- 11) M. Hakamada and M. Mabuchi: J. Alloy. Compd. 485(2009) 583-587.
- 12) R. Li and K. Sieradzki: Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 1168–1171.
 13) S. Parida, D. Kramer, C. A. Volkert, H. Rösner, J. Erlebacher and J. Weissmüller: Phys. Rev. Lett. 97(2006) 035504.
- 14) S. Trasatti and O. A. Petrii: J. Electroanal. Chem. 327(1992) 353-376.
- 15) M. Hakamada and M. Mabuchi: Nano Lett. $\mathbf{6}(2006)$ 882–885.
- 16) D. M. Artymowicz, J. Erlebacher and R. C. Newman: Philos. Mag. 89(2009) 1663-1693.
- 17) S. Koh and P. Strasser: J. Am. Chem. Soc. 129(2007) 12624-12625.
- 18) D. T. Sawyer and J. L. Roberts, Jr.: Experimental Electrochemistry for Chemists, (John Wiley and Sons, New York, 1974) p. 67.
- 19) H. Liu, P. He, Z. Li and J. Li: Nanotechnology 17 (2006) 2167-2173.